

南台科技大學 98 學年度第 2 期課程資訊

課程名稱	VLSI 測試理論
課程編碼	30M00701
系所代碼	03
開課班級	博研電子一甲 碩研電子一甲 海研電子一甲 碩研通訊一甲
開課教師	蔣富成
學分	3.0
時數	3
上課節次地點	五 7 8 9 教室 S607
必選修	選修
課程概述	介紹數位 IC 錯誤產生的原因、將其表現的方式模式化，進而瞭解如何產生測試樣本將錯誤測試出來。
課程目標	了解各種數位 IC 錯誤的模式並了解如何產生測試樣本。
課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.測試簡介 2.錯誤模式化 3.錯誤縮減 4.錯誤模擬 5.組合電路測試樣本產生 6.序向電路測試樣本產生 7.設計植入測試考量 8.邊界掃瞄 9.內建式自我測試 10.記憶體測試
英文大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.Introduction 2.Fault modeling 3.Fault collapsing 4.Fault simulation 5.Combinational test generation 6.Sequential test generation 7.Design for Testability (DFT) 8.Boundary scan 9.Built-in-self-test (BIST) 10.Memory testing
教學方式	課堂教授,
評量方法	自行設計測驗,口頭報告,
指定用書	Testing Semiconductor Memory Theory and Practice
參考書籍	IEEE Solid State Circuit
先修科目	數位系統設計

教學資源	參考 Black Board
注意事項	請勿睡覺,吃東西,聊天,遲到或缺曠
全程外語授課	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	
輔導考照 2	